****

**ПРИМЕР**

**оформления списка использованных источников**

(формируется по мере использования в диссертации)

**Список использованных источников**

1. Кечиев, Л.Н. Защита электронных средств от воздействия статического электричества / Л.Н. Кечиев, Е.Д. Пожидаев. – М.: Изд. дом «Технологии», 2005. – 352 с.

2. Чермошенцев, С.Ф. Информационные технологии электромагнит­ной совместимости электронных средств / С.Ф. Чермошенцев. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2000. – 152 с.

3. Гизатуллин, 3.М. Моделирование поведения цифровых элементов при воздействии электростатического разряда / З.М. Гизатуллин // Электронное приборостроение. – 2002. – № 26. – С. 98–107.

15. Белов, А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике / А.В. Бе­лов. – СПб.: Наука и Техника, 2003. – 224 с.

16. Фрунзе, А.В. Микроконтроллеры? Это же просто: в 3 т. / А.В. Фрунзе. – М.: ООО «ИД СКИМЕН», 2002–2003. – 3 т.

17. Микушин, А.В. Занимательно о микроконтроллерах / А.В. Микушин. – СПб.: БХВ–Петербург, 2006. – 432 с.

18. Нарышкин, А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.К. Нарышкин. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320 с.

19. Суэмацу, Е. Микрокомпьютерные системы управления. Первое знакомство / Е. Суэмацу; пер. с яп.; под ред. Е. Амэмия. – М.: Изд. дом «До­дэка–ХХI», 2002. – 256 с.

23. Васильев, А.Е. Микроконтроллеры. Разработка встраиваемых приложений / А.Е. Ва­сильев. – СПб.: БХВ–Петербург, 2008. – 304 с.

24. Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры / В.И. Бойко [и др.]. – СПб.: БХВ–Петербург, 2004. – 464 с.

25. Урбанович, П.П. Избыточность в полупроводниковых интегральных микросхемах памяти / П.П. Урбанович, В.Ф. Алексеев, Е.А. Верниковский. – Минск: Навука і тэхніка, 1995. − 262 с.

29. Гуртов, В.А. Твердотельная электроника / В.А Гуртов. – М.: Изд. «Техносфера», 2008. – 478 с.

30. Майоров, С.А. Введение в микроЭВМ / С.А. Майоров, В.В. Кириллов, А.А. Приблуда. – М.: Изд. «Машиностроение», 1988. – 304 с.

32. New ultra high density EPROM and flash EEPROM with NAND structure cell / F. Masuoka [et al.] // Electron Devices Meeting, 1987 International. – 1987. – Vol. 33. – P. 552–555.

36. Шарстнев, В.Л. Компьютерные информационные технологии: курс лекций / В.Л. Шерстнев. – Витебск: УО ВГТУ, 2008. – 350 с.

37. Белов, А.В. Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике / А.В. Белов. – СПб.: Наука и Техника, 2007. – 352 с.

47. Кохц, Д. Измерение, управление и регулирование с помощью PIC микроконтроллеров / Д. Кохц; пер. с англ. Ю. Шпак. – М.: МК–Пресс, 2006. – 304 с.

49. Редькин, П.П. 32/16-битные микроконтроллеры ARM7 семейства АТ91SAM7 фирмы Atmel / П.П. Редькин. – М.: Изд. дом «Додэка–XXI», 2008. – 704 c.

50. Amerasekera, A. ESD in Silicon Integrated Circuits / A. Amerasekera, C. Duvvury. – John Wiley & Sons, Ltd, 2003. – 421 p.

52. Electrostatic discharge in semiconductor devices: overview of circuit protection techniques / J.E. Vinson [et al.] // Electron Devices Meeting. – 2000. – P. 5–8.

53. ESD Protection Design to Overcome Internal Damage on Interface Circuits of a CMOS IC With Multiple Separated Power Pins / Ker Ming-Dou [et al.] // IEEE Transactions on components and packaging technologies. – 2004. – Vol. 27, № 3. – P. 445–451.

54. Interaction between electrostatic discharge and electromigra­tion on copper interconnects for advanced CMOS technologies / D.K. Kontos [et al.] // Proc. of the Int. Reliability Physics Symp. – 2005. – Р. 91–97.

55. ESD protection circuit design for ultra-sensitive IO applica­tions in advanced sub-90nm CMOS technologies / M. Mergens [et al.] // Circuits and Systems, ISCAS. – 2005. – Vol. 2. – P. 1194–1197.

56. ESD protected power amplifier design in CMOS for highly relia­ble RF ICs / A. Wang [et al.] // IEEE Journals & magazines. – 2011. – Vol. 58, № 7. – P. 2736–2743.

57. The effect of electrostatic discharge on electrical overstress sus­ceptibility in a gallium arsenide MESFET-based device / V. Evaloy [et al.] // IEEE Journals & magazines. – 2007. – Vol. 7, № 1. – P. 200–208.

63. Микросхемы интегральные. Методы испытаний. Методы электриче­ских испытаний. Ч. 7: ОСТ 11 073.013–2008. – Введ. 01.01.09. – Российская Федерация: Госстандарт России, 2009. – 35 с.

72. Кириллов, В.Ю. Электромагнитная совместимость элементов и уст­ройств бортовых систем летательных аппаратов при воздействии электроста­тических разрядов: автореф. дис. … докт. техн. наук: 05.13.05 / В.Ю. Кирил-лов. – М.: 2002. – 35 с.

83. Абрамов, И.И. Проблемы и принципы физики и моделирования при­борных структур микро- и наноэлектроники. Основные положения / И.И. Абрамов // Нано- и микросистемная техника. – 2006. – Ч. I, № 8. – С. 34–37.

84. Абрамов, И.И. Проблемы и принципы физики и моделирования при­борных структур микро- и наноэлектроники. Модели полуклассиче­ского подхода / И.И. Абрамов // Нано- и микросистемная техника. – 2006. – Ч. II, № 9. – С. 26–36.

85. Абрамов, И.И. Проблемы и принципы физики и моделирования при­борных структур микро- и наноэлектроники. Численное моделирова­ние / И.И. Абрамов // Нано- и микросистемная техника. – 2007. – Ч. III, № 1. – С. 36–37.

86. Абрамов, И.И. Проблемы и принципы физики и моделирования при­борных структур микро- и наноэлектроники. Квантомеханические формализмы / И.И. Абрамов // Нано- и микросистемная техника. – 2007. – Ч. IV, № 2. – С. 24–32.

87. Абрамов, И.И. Проблемы и принципы физики и моделирования при­борных структур микро- и наноэлектроники. Резонансно-туннельные структуры / И.И. Абрамов // Нано- и микросистемная техника. – 2007. – Ч. V, № 3. – С. 57–70.

88. Абрамов, И.И. Проблемы и принципы физики и моделирования при­борных структур микро- и наноэлектроники. Одноэлектронные структуры / И.И. Абрамов // Нано- и микросистемная техника. – 2007. – Ч. VI, № 7. – С. 10–24.

89. Абрамов, И.И. Проблемы и принципы физики и моделирования при­борных структур микро- и наноэлектроники. Структуры на кванто­вых проволоках / И.И. Абрамов // Нано- и микросистемная техника. – 2009. – Ч. VII, ч. 1, № 7. – С. 14–29.

90. Абрамов, И.И. Проблемы и принципы физики и моделирования при­борных структур микро- и наноэлектроники. Структуры на кванто­вых проволоках / И.И. Абрамов // Нано- и микросистемная техника. – 2009. – Ч. VII, ч. 2, № 8. – С. 7–23.

91. Абрамов, И.И. Проблемы и принципы физики и моделирования при­борных структур микро- и наноэлектроники. Нанотранзисторы с МДП-структурой / И.И. Абрамов // Нано- и микросистемная техника. – 2010. – Ч. VIII, ч. 1, № 9. – С. 27–37.

92. Абрамов, И.И. Проблемы и принципы физики и моделирования при­борных структур микро- и наноэлектроники. Нанотранзисторы с МДП-структурой / И.И. Абрамов // Нано- и микросистемная техника. – 2010. – Ч. VIII, ч. 2, № 10. – С. 28–41.

93. Абрамов, И.И. Проблемы и принципы физики и моделирования при­борных структур микро- и наноэлектроники. Нанотранзисторы с МДП-структурой / И.И. Абрамов // Нано- и микросистемная техника. – 2010. – Ч. VIII, ч. 3, № 11. – С. 29–42.

94. Абрамов, И.И. Проектирование аналоговых микросхем для прецизион­ных измерительных систем: монография / И.И. Абрамов, О.В. Дворников; Бе­лорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники. – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2006. – 286 с.

104. Ланин, В.Л. Формирование токопроводящих контактных соедине­ний в изделиях электроники / В.Л. Ланин, А.П. Достанко, Е.В. Телеш. – Минск: Изд. центр БГУ, 2007. – 574 с.

105. Белоус, А.И. Основы проектирова­ния и применения микроэлектрон­ных устройств силовой электроники / А.И. Белоус, А.С. Турцевич, С.А. Ефи­менко. – Го­мель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 264 с.

106. Романова, М.П. Сборка и монтаж интегральных микросхем: учеб. пособие / М.П. Романова. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 95 с.

109. Heat Transfer Module User’s Guide // COMSOL Software [Electronic resource]. – 2012. – Mode of access: http://ru.scribd.com/doc/62966870/COMSOL-3-5-Heat-Transfer-Module-User-Guide. – Date of access: 10.01.2013.

112. Цаплин, А.И. Теплофизика в металлургии: учеб. пособие / А.И. Цап­лин. – Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2008. – 230 с.

122. Datasheet // Atmel Corporation [Electronic resource]. – 2011. – Mode of access: http://www.atmel.com/Images/doc2543s.pdf. – Date of access: 05.07.2011.

123. Datasheet // Company «INTEGRAL» [Electronic resource]. – 2012. – Mode of access: http://www.integral.by/download/41/IN89%F12051.pdf. – Date of access: 07.08.2012.

124. Datasheet // Atmel Corporation [Electronic resource]. – 2012. – Mode of access: http://www.atmel.com/Images/doc1920.pdf. – Date of access: 28.07.2012.

**Список публикаций соискателя**

1–А. Методика испытания микроконтроллеров на чувст­ви­тельность к элек­тростатическим разрядам / В.Ф. Алексеев, Н.И. Силков, Г.А. Пискун, А.Н. Пикулик // Доклады БГУИР. – 2011. – № 5 (59). – С. 5–12.

2–А. Алексеев, В.Ф. Методика оценки устойчивости микроконтроллеров к воздействию разрядов статического электричества при ступенчатом повы­шении напряжения / В.Ф. Алексеев, Г.А. Пискун // Вестник Рязанского госу­дарствен­ного радиотехнического университета. – 2012. – № 2 (40). – С. 34–40.

3–А. Пискун, Г.А. Контроль функционирования микроконтроллеров при воздействии электростатического разряда / Г.А. Пискун, В.Ф. Алексеев // Док­лады БГУИР. – 2012. – № 6 (68). – С. 12–18.

4–А. Алексеев, В.Ф. Влияние разрядов статического электричества на про­граммное обеспечение, инсталлированное во встроенную flash-память мик­ро­контроллеров / В.Ф. Алексеев, Г.А. Пискун // Радиоэлектроника и ин­форма­тика. – 2012. – № 3 (58). – С. 8–12.

5–А. Брылева, О.А. Основные механизмы повреждения микроконтрол­ле­ров вследствие влияния электростатических разрядов / О.А. Брылева, В.Ф. Алексеев, Г.А. Пискун // Вестник Белорусско-Российского университета. – 2013. – № 2 (39). – С. 130–137.

6–А. Пискун, Г.А. Методы технической диагностики микроконтроллеров при воздействии электростатических разрядов / Г.А. Пискун, В.Ф. Алексеев, О.А. Брылева // Вестник Белорусско-Российского университета. – 2013. – № 2 (39). – С. 156–163.

7–А. Пискун, Г.А. Компьютерное моделирование процесса развития элек­тростатического разряда в COMSOL Multiphysics / Г.А. Пискун, О.А. Кис­тень // Новые направления развития приборостроения: материалы 4-й Между­нар. студ. науч.-техн. конф., Минск, Респ. Беларусь, 16–18 ноября 2011 г. / БНТУ. – Минск, 2011. – С. 378–379.

8–А. Пискун, Г.А. Математическое описание развития ЭСР в газовой среде в программном пакете COMSOL Multiphysics / Г.А. Пискун, О.А. Кистень // Новые направления развития приборостроения: материалы 4-й Междунар. студ. науч.-техн. конф., Минск, Респ. Беларусь, 16–18 ноября 2011 г. / БНТУ. – Минск, 2011. – С. 380–381.

9–А. Алексеев, В.Ф. Калибровка систем измерения тока разряда как одно из условий получения достоверных результатов при проведении испы­таний ра­диоэлектронного оборудования на устойчивость к электростатиче­ским разря­дам / В.Ф. Алексеев, Г.А. Пискун, О.А. Кистень // Научные стрем­ления – 2011: материалы Междунар. науч.-практич. конф. молодых ученых, Минск, Респ. Бе­ларусь, 14–18 ноября 2011 г. / Совет молодых ученых Национальной ака­демии наук Беларуси. – Минск: Белорусская наука, 2011. – С. 613–617.

10–А. Пискун, Г.А. Математическое описание процесса формирования ис­точника тепла при воздействии мощного электромагнитного импульса на инте­гральные схемы / Г.А. Пискун // Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій «РТ–2010»: матеріали 6-оі міжнар. молодіжної наук.-техн. конф., Севастополь, Украина, 19–24 квітня 2010 г. / Севастоп. нац. техн. ун-т; редкол.: Ю.Б. Гимпилевич [і др.]. – Севастополь, 2010. – С. 420.

11–А. Пискун, Г.А. Расчет тепловых процессов во внутренних выводах ин­те­гральных схем при протекании импульсного тока / Г.А. Пискун // Сб. тези­сов 28-ой науч.-техн. конф. ОАО «АГАТ-системы управ­ления», Минск, Бела­русь, 11–12 мая 2011 г. / ОАО «АГАТ-системы управления». – Минск, 2011. – С. 68–69.

12–А. Способ испытания микроконтроллеров на устойчивость к воздей­ст­вию электростатических разрядов : пат. 17253 Респ. Беларусь, МПК G 01R 31/26, G 11C 29/52 / Г.А. Пискун, В.Ф. Алексеев, О.А. Брылева; заявитель Бело­русский государственный университет ин­форма­тики и радиоэлектроники. – № а 20120290; заявл. 28.02.2012; опубл. 30.06.13 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2013. – № 3. – С. 142–143.